EXAFS的分辨率和信噪比与 实验参数间相互关联的探讨

金属物理教研室 对建民赵伯麟 陈训平 吴平

摘 要

本文詳細讨论了EXAFS测定的分辨本领、信噪比与实验参数间的相互关联; 提出了实验参数临界条件的概念及其确定的方法;在临界条件下分别讨论了分辨本领、信噪比与临界实验参数值的相互关系并由此导出如下结论:1. 当入射狭缝, 出射狭缝 宽度 均为 临界参数 时, EXAFS测定的分辨本领与分光晶体摆动曲线的 宽度无关,而信噪比则取决于分光晶体摆动曲线宽度所表征的嵌镶块大小对强度分 布和消光效应的影响。2. 当接收狭缝,分光晶体摆动曲线的 宽度均 为临界 参数 时,入射狭缝可增至最佳宽度,其分辨本领不仅保持不变,还能显著提高信噪比。 当入射狭缝辐续增大,超过最佳宽度时,信噪比不再增加。文中由此指出:当所用 分光晶体完整性欠佳时,以采用结论1的条件为宜;当分光晶体完整性较好则应采 用用结论2所提出的条件。

一、问题的提出

X射线吸收限扩展细结构(以下简称EXAFS)的分辩率和信噪比与入射狭缝S₁, 接收 狭缝S₂,分光晶体摆动曲线宽度δ以及光源的有效线宽S₁′具有十分密切的关系是显而易见 的。但是这种关系的具体形式如何,它们在什么条件下相互关联,以及诸参数间如何匹配等 问题仍需予以讨论并从讨论中引出可能的最佳条件。

二、EXAFS分辨本领的描述

只要将布拉格公式2d sin θ = λ 除以该式对 θ 和 λ 的微分式2d cos θ · $\Delta \theta$ = $\Delta \lambda$ 就能 得到分辨 本领的一般表达式;

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\mathrm{tg}\theta}{\Delta\theta} \tag{1}$$

式中d——晶面间距, λ ——波长, θ ——布拉格角。由公式(1)不难看出, 所谓分辨本领 就是当波长改变时相邻两个信息能够清晰区分的一种度量。在一定 θ 角下测量时, EXAFS 的分辨本领显然取决于进入接收狭缝S₂的波长范围即 $\Delta \lambda$, 或者说取决于由 $\Delta \lambda$ 所导致的 $\Delta \theta$ 。 所以研究EXAFS分辨本领与上述诸参数的关系即研究由 $\Delta \lambda$ 所导致的 $\Delta \theta$ 与这些参数的关系°

102



图1 水平截面光路图,图中S₁—入射狭缝;
 S₂—接收狭缝:A—点光源:β—分光晶体:C—计数管:A'
 —A的虚象;Ak= A'k=kk'=R
 Ag=r; k'至C距离为r'。

1. 分光晶体为理想完整情况

(1) 点光源

当分光晶体为理想完整并由点光源辐射时,由于λ射波长的连续性使其在入射束发散范 围内的全部射线都能满足布拉格定律而发生反射,其反射情况如同可见光的镜面反射(参看 图1)。此时反射束的发散度为

而

$$\Delta \theta' = \frac{S_2}{2R}$$
(2)

并且

$$\Delta \theta_{1}' = \frac{S_{1}}{r}$$

$$\Delta \theta_{1} = \Delta \theta'$$
(3)

$$\mathbb{P} \quad \frac{S_1}{r} = \frac{S_2}{2R} \tag{42}$$

EXAFS的分辨本领为: $\frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{tg\theta}{S_2} 2R$

(2) 非点光源

实际光源均有一定大小而非点源,但只要给予简单处理就能使其等效于一新点光源。例 如在出射狭缝之前加以辅助狭缝S₁′或者当非点光源的尺度与管压、偏压的函数关系均为已 知时亦可将光源有效线宽视为辅助 狭缝 S₁′(其结果完全一样)均可使非点光源A转换为



图2 由非点光源变换为点源的光路图,图中 $\Delta \theta$ — 非点光源 (或称 新点 源a) 反射 束的发射度, $\Delta \theta = \Delta \theta_{12}$ a—新点 源; a'——新点源a的虚象: af = a'f', S₁' —非点光源的有效线宽。

(5)

一新的点源a(参见图 2)。此时反射束的发散度为:

$$\Delta \theta = \frac{S_2}{2R - a'f'}$$
$$\Delta \theta_1 = \frac{S_1'}{a'f'}$$

式中a'f'可由图3的关系导出。 因为

所以

$$\frac{S_1}{ag} = \frac{S_1'}{af}$$

将ag = r - af代入可得

$$\overline{af} = \frac{S_1'r}{S_1 + S_1'}$$

将af分别代入(6)(7)式得

$$\Delta \theta = \frac{S_2}{2R - \frac{S_1'r}{S_1 + S_1'}}$$
(6')
$$\Delta \theta_1 = \frac{S_1 + S_1'}{r}$$
(7')
$$\frac{S_1 + S_1'}{r} = \frac{S_2}{2R - \frac{S_1'r}{S_1 + S_1'}}$$
(8)

其分辨本领为:

$$\frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{\mathrm{tg}\theta}{\mathrm{S}_2} \left(2\mathrm{R} - \frac{\mathrm{S}_1'\mathrm{r}}{\mathrm{S}_1 + \mathrm{S}_1'} \right) \qquad (9)$$

2. 分光晶体为嵌镶状态情况

当分光晶体为嵌银状态时,虽然由于入射线A,平A,经 嵌银块协调或者说补偿可成mm'和nn'反射而使反射束变 $restartheta为\Delta \theta_{1,1}$ 但分辨本领并不因此下降,因为在满足光路图4的 件条下嵌银块的协调只改变反射束的方向而不能导致 Δλ的 图4 说明嵌镶块只改变反射线 改变。由图 4 不难说明 Δ λ的长波 线 m m π 其反射 角为 θ_m , 短波线nn"其反射角为 θ_n ", 而mm'线的反射角 θ_n "显然小 于 θ_{n} ", 大于 θ_{n} ",也就是说 θ_{n} "值必在 θ_{n} "和 θ_{n} "之间,即mm/ 反射波长 必在mm"和nn"反射线波长之间。同理可





(6)

(7)

af与S1'

S₁和r的

关系。

己知 a'f' = af

图 3

相应的临界值。

104

三、分辨本领和信噪比与诸参数相互

关系的讨论—最佳条件的引出

1. 分光晶体摆动曲线宽度与分辨本领和信噪的关系

(1) 摆动曲线临界宽度的引入和导出

我们将满足光路图 4 的条件称为临界条件,将相应于 $S_1 = a_k$, $S_2 = b_k$ (此处系指 点光 源情况,对非点光源也一样)的摆动曲线宽度称为摆动曲 线的临 界宽 度 δ_k (其含义将在下 一问题讨论), δ_k 的关系式可由图 5 予以导出。



根据EXAFS测量所要求的分辨本领可算出相应的 a_k 和 b_k ,然而要确定相应的 δ_k 就必须找出 $\Delta \theta_k$ 与S₁和S₂的关系。由图6所示可得

$$\Delta \theta_{\mathbf{x}} = \varphi + \omega \tag{13}$$

式中φ可由Δmik和直角三角形Δik/m/求出,即

$$\frac{l_1}{\sin\varphi} = \frac{R - ik'}{\sin\beta}$$
(14)

$$\beta = \theta - \omega \tag{15}$$

$$\frac{dS_2}{dk'} = tg\varphi$$
(16)

将(14)(15)(16)式联立求解可得:

$$l_{1}\sin(\theta - \varphi) = R\sin\varphi - ik'\sin\varphi$$
$$\frac{l_{1}\sin(\theta - \varphi)}{ik'} = \frac{R\sin\varphi - l_{1}\sin(\theta - \varphi)}{\sin\varphi}$$

将ik'代入(16)式得

.

ς.

$$\frac{1}{2}S_{2} = tg\varphi \cdot \frac{R\sin\varphi - l_{1}\sin(\theta - \varphi)}{\sin\varphi}$$
$$\frac{l_{1}}{2}S_{2}\cos\varphi = R\sin\varphi - l_{1}\sin\theta\cos\varphi + l_{1}\cos\theta\sin\varphi$$

将等式两边同除以sinφ可得

 $\frac{1}{2}S_2\cot\varphi = R - l_1\sin\theta\cot\varphi + l_1\cos\theta$

$$\cot \varphi = \frac{\mathbf{R} + l_1 \cos \theta}{\frac{1}{2}\mathbf{S}_2 + l_1 \cos \theta}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg}\left\{\frac{\frac{1}{2}S_2 + l_1 \sin\theta}{R + l_1 \cos\theta}\right\}$$
(17)

同理可由△jnk和直角三角形△jk'n'列出如下方程:

$$\frac{l_2}{\sin\omega} = \frac{R - jk'}{\sin\alpha}$$
(18)

$$\alpha = \theta + \omega \tag{19}$$

$$\frac{\frac{1}{2}S_{2}}{ik'} = tg\omega$$
 (20)

将(18)(19)(20)式联立求解可得。

$$\cot \omega = \frac{R - l_2 \cos \theta}{\frac{1}{2}S_2 + l_2 \sin \theta}$$

$$\omega = \arctan\left\{\frac{\frac{1}{2}S_2 + l_2 \sin \theta}{R - l_2 \cos \theta}\right\}$$
(21)

下边只要求出*l*₁和*l*₂与已知参数的关系并分别代入(17)式和(21)式再一并代入(13)式就 能得到可以计算的Δθ_x的表达式。

由图6△amk可得:

$$\frac{l_1}{\sin \frac{1}{2} \Delta \theta_1} = \frac{\mathbf{R}'}{\sin \gamma}$$

106

ι

.

$$R' = R - a'f' = R - \frac{S_1'r}{S_1 + S_1'}$$

$$\gamma = 180^\circ - (\theta + \frac{1}{2}\Delta\theta_1)$$

$$l_1 = (R - \frac{S_1'r}{S_1 + S_1'}) \frac{\sin\frac{1}{2}\Delta\theta_1}{\sin(\theta + \frac{1}{2}\Delta\theta_1)}$$
(22)

由∆ank可得。

$$\frac{l_2}{\sin\frac{1}{2}\Delta\theta_1} = \frac{R'}{\sin\phi}$$
$$\phi = \theta - \frac{1}{2}\Delta\theta_1$$

所以

$$I_{2} = (R - \frac{S_{1}'r}{S' + S_{1}'}) \frac{\sin \frac{1}{2}\Delta\theta_{1}}{\sin (\theta - \frac{1}{2}\Delta\theta_{1})}$$
(23)

最终求得

$$\Delta \theta_{x} = \arctan \left\{ \frac{\frac{1}{2}S_{2} + (R - \frac{S_{1}'r}{S_{1} + S_{1}'}) - \frac{\sin \frac{1}{2}\Delta \theta_{1} \cdot \sin \theta}{\sin (\theta + \frac{1}{2}\Delta \theta_{1})}}{R + (R - \frac{S_{1}'r}{S_{1} + S_{1}'}) - \frac{\sin \frac{1}{2}\Delta \theta_{1} \cdot \cos \theta}{\sin (\theta + \frac{1}{2}\Delta \theta_{1})}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}S_{2} + (R - \frac{S_{1}'r}{S_{1} + S_{1}'}) - \frac{\sin \frac{1}{2}\Delta \theta_{1} \cdot \sin \theta}{\sin (\theta - \frac{1}{2}\theta\Delta_{1})}}{\frac{1}{2}S_{2} + (R - \frac{S_{1}'r}{S_{1} + S_{1}'}) - \frac{\sin \frac{1}{2}\Delta \theta_{1} \cdot \sin \theta}{\sin (\theta - \frac{1}{2}\theta\Delta_{1})}} \right\}$$

$$(24)$$

(3) 摆动曲线宽度与分辨本领的关系

由图 4 所示的光路条件可以看出, 单独改变δ的大小不影响Δ λ 的大小,也就是说当S₁ = a_k, S₂ = b_k不变时,分辨本领与δ的大小无关,也就是说当分光晶体不理想时,我们可 以根据分辨本领的要求按照临界条件缩小S₁和S₂而不考虑摆动曲线宽度的大小。这在实验 上是有其一定用途的。至于δ改变对信嗓比的影响则取决于嵌块大小对强度分布的影响和对 消光效应的影响的主次。当嵌银块大小对强度分布的影响为主时信嗓比下降,当其对消光效 应的影响为主时信嗓比增强。

2. 入射狭键S1与分辨本领和信噪比的关系

当S₂=b_k, δ=δ_k保持不变而减小入射狭缝S₁(S₁<a_k)时可以看出, 由Am₁和An¹ 入射的X射线经嵌银块协调(无波长改变)所成的反射d₁n₁'和m₁m₁' 其宽度Δθ_x₁<Δθ_x, 由波长改变(无嵌银块协调)所形成的反射n₁n₁"和m₁m₁"其发散度Δθ₁<Δθ(参看图7), 亦即Δλ_{x1}<Δλ_x,可见当S₁<a_k时,分辨本领将随S₁的减小而增大,而信噪比则随之降 低。可以说明当S₁>a_k时,Δλ_x和Δθ_x均与S₁的增大无关。由图8 可以看出,当S₁=a(a< a_k)时,入射到u处的Au线将有两种可能的反射,即uu"和uu',前者为波长变化的反射 (无嵌银块协调),后者为嵌银块补偿的反射(无波长改变)。显然uu"反射,其反射角θ_u"必 然小于nn"的反射角θ_{nn}",所以uu"向右





- 图7 当 $S_2 = b_k$, $\delta = \delta_k$, $S_1 < a_k$ 时, 分辨本领随 S_1 的减小面增大, 信 喀比则随之降低的示意图。
- 図8 当 $S_2 = b_k$, $\delta = \delta_k$, $S_1 > a_k$ 时, $\Delta \lambda_x \pi \Delta \theta_x = u u'' \pi v v'' 无关$, $\Delta \theta_x = u u' \pi v v'' 无关的示意图$

偏离于nn"而无法进入接受狭缝S₂,亦即 $\Delta \lambda_x \Lambda \Delta \theta_x = u u'$ 反射无关。 同理可以说明 $\Delta \lambda_x \Lambda \Delta \theta_x = v v'$ 无关。 uu'反射与nn'相比由于 $\delta_u = \delta_n = \frac{1}{2} \delta_x$,前者的反射角 θ_u' 必然小于后者的反射角 θ_n' ,因此uu'必然向右偏离于nn'而不可能导致 $\Delta \theta_x$ 的增大。同理可以说明 v v'亦不可能导致 $\Delta \theta_x$ 增大。 余下的问题是要说明 uu'反射会不会导致 $\Delta \lambda_x$ 的增大。为此只要将uu'的反射角 θ_n' 与nn"的反射角 θ_n "加以比较即可判定。



- 图9 说明S₂=b_k, $\delta = \delta_k$, S₁= a(a>a_k)时, $\Delta \lambda_x = uu' 反$ 射无关。

图10 在 $S_1 = a_k$, $\delta = \delta_k$ 时, $\Delta \lambda_x$ 随 S_2 改变而 改变的示意图

 $\psi + (\theta_u' - \delta_u) + (180^\circ - \theta_u'') = 180^\circ$

$$\psi - \delta_n = \theta_n'' - \theta_u'$$
(25)

由公式(25)式可以看出,当 $\psi = \delta_n$ 时, $\theta_n'' = \theta_u'$,此时说明uu'与nn'重合 (nn''为 $\Delta\lambda$ 的 短波限),自然不会导致 $\Delta\lambda_x$ 的增大;当 $\psi < \delta_n$ 时,则 $\theta_u' > \theta_m''$,此时说明uu'反射波长比 nn''为长,即不可能增大 $\Delta\lambda_x$;当 $\psi > \delta_n$ 时, $\theta_u' < \theta_n''$,即uu'波长短于nn''波长,但是由 于 $\theta_u < \theta_n''$,uu'反射线显然向右偏离于nn''而无法进入 S_2 狭缝,亦即 $\Delta\lambda_x$ 与uu' 无关。同 理可以说明 $\Delta\lambda_x$ 与vv'无关。由此我们得到一个重要结论,即在临界条件下当 $S_2 = b^k, \delta = \delta_k$, $S_1 > a_k$ 时不但分辨本领保持不变,而且在 S_1 增大过程中当 $\psi < \delta_n$ 时其信 嗓比还有显著的增强(由于uu'和vv'反射进入狭缝 S_2 的结果)。

综上所述,只要我们根据测显需要的分辨本领确定诸参数的临界值 (至此可 以了 解δ₁ 引入导出和计算的必要性)就可以保持其中两个参数不变,增大δ或S₁使分辨本领不变并获 得较大的信噪比,而没有必要按Lytle(1)等人所提出的让S₁、S₂和δ基本相等的要求进行 调节。

3. 接收狭稳S2的影响

接收狭缝S₂与分辨本领的关系是十分敏感的, 当S₂<b_k时, $\Delta\lambda_x$ 随S₂的改变而改变, 当S₂>b_k时, $\Delta\lambda_x$ 亦随S₂的改变而改变。正如图10所示, 当S₂>b_k时, A_n入射线由于在 n处存在着与 δ_n 倾角相反的嵌银块倾斜 δ_n '的补偿使其形成nn₁'反射, 不难看出nn₁'反射 角 θ_n ' = θ_n " - δ_{n_1} 小于nn"反射角 θ_n ", 故nn₁'反射线波长短于nn"反射线波长从而增大了 $\Delta\lambda_x$, 使得EXAFS测量的分辨本领下降。因此当根据分 辨本领的要求一旦确定 b_k之后, S₂就必须等于b_k而不能随意加大。

4. a_k 、 b_k 和 δ_k 的具体计算

在EXAFS测量之前必须首先确定ak、bk和ôk,具体步骤如下:

(1) 根据分辨本领的要求确定a_k和b_k

假定我们需要的分辨本领为1000,则有:

$$\frac{\mathrm{tg}\theta}{\Delta\theta} = 1000$$

如果以C_u试样为例,则在距K吸收限为30ev的测量波长相应的分光晶体反射角θ为19.98°, 此时

$$\Delta \theta = \frac{tg_{19,98}^{\circ}}{1000} = 0.0003636(30\%) = 0.020834(^{\circ})$$

根据公式(7')Δθ₁ = Δθ = = $\frac{S_1 + S_1'}{r}$ (对非点光源而言) 可确定S₁ (S₁'由实验条件确定) S₁ = a₁ = Δθ•r = S₁'

$$S_1 = a_k = \Delta U = S_1$$

将S₁'=0.05mm, r=159.5mm代入上式可得 S₁=ak=0.00799≐0.08(mm)

由公式(8)

$$\Delta \theta_1 = \Delta \theta = \frac{S_2}{2R - \frac{S_1'r}{S_1 + S_1'}}$$

可确定S₂

$$S_2 = b_k = \Delta \theta \cdot (2R - \frac{S_1'r}{S_1 + S_1'})$$

将S₁=0.00799mm, S₁'=0.05mm, $\Delta \theta$ =0.0003636(弧度)R=250mm代入上式可得 S₂=b_k=0.1318mm

(2) 计算Δθ_x

将仪器常数r、R和计算所得数据 θ 、 $\Delta \theta_1$ 、 S_1 、 S_1 和 S_2 代入(24)式可得

$$\Delta \theta_{x} = \varphi + \omega = 0.0197785^{\circ} + 0.0197956$$

$$= 0.0395741^{\circ} = 0.04^{\circ}$$

(3) 计算在 $S_1 = a_k$, $S_2 = b_k$ 条件下分光晶体摆动曲线的临界宽度 δ_k 由公式(12)可计算 δ_k , 可见平晶光条件下 δ_k 小于聚焦分光条件下的 δ_k [2]。

$$\delta_{k} = \frac{\Delta \theta_{k} + \Delta \theta_{k}}{2} = \frac{0.0208^{\circ} + 0.0396}{2} = 0.0302^{\circ}$$

(4)根据ak、bk和dk的数值及现实的实验条件确定合理的实验方案。

选用Cu试样,在确定分辨本领为1000(EXAFS测量下限要求)的条件下 经计算 得 $a_k = 0.008 \text{ mm}$, $b_k = 0.132 \text{ m}$ E, $\delta_k = 0.030^\circ$ 。考虑到 $a_k \chi$ 小,入射强度损失较大且不易制做,所以实验方案拟将用保持 $b_k = 0.132 \text{ mm}$ 不变,将分光晶体的摆 动曲线 宽度调至 $\delta = \delta_k = 0.03^\circ$,而增大入射狭缝S₁的方案为宜。而S₁ 增大的 最佳宽度 S_{1k}可根 据 $\psi = \delta_n = \frac{1}{2} \delta_k$, $2\psi = \delta_n + \delta_m = \delta_k$ 算出(见图9)即:

$$\Delta \theta_{\lambda k} = \Delta \theta_{\lambda} + \delta_{k} = \frac{S_{1}' + S_{1k}}{r}$$
(26)

$$S_{1k} = \Delta \theta_{\lambda} \cdot r - S_{1}' = \frac{\Delta \theta_{\lambda} + \delta_{k}}{r} - S_{1}'$$
(27)

式中Δθ₁k——相应入射(即出射)狭缝最佳宽度S₁k的入射束发散度。将已知常数和计算值 代入(27)式可得

$$S_{1k} = \frac{(0.0208 + 0.0302}{57.29} \times 159.5 - 0.05 \doteq 0.092 (mm)$$

当S₁继续增大时(S₁>S_{1k}),分辨本领保持不变,但信噪比却不再增大。故继续增大S₁已 无实际 意义。如果所用分光晶体完整性欠佳,无法满足 δ_k 的要求,此时只能 $\diamond b_k =$ 0.132mm,将S₁调至 $a_k = 0.008mm$,从而放宽对摆动曲线宽度 δ 的苟刻要求。

5. 临界条件与待测试样的关系

临界条件(即a_k、b_k和δ_k的数值)显然还 与待 测试样 有关。因为 当分 辨本领 根据 EXAFS要求选定后,由于待测试样原子序数的不同(此时吸收限λ_k亦不相同)必然导致 距吸收限30ev处测量波长所要求的分光晶体反射角θ的不同(反射晶面不变)。由公式(I) $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = tg\theta/\Delta\theta$ 可以看出,当 $\frac{tg\theta}{\Delta\theta} = 1000$ 时,θ的改变会导致Δθ的改变,而Δθ的改变就导致 a_k、b_k和δ_k的改变。例如当待测试 样原子序 数较大时,由于它的吸收限λ_k较小(即λ_k较 短),自然距λ_k30ev处起始测量波长就短,在反射晶面不变时其分光晶体相应的反射角θ就 小,因此在保持分辨本领仍为1000时所允许的Δθ就小,从而a_k、b_k和δ_k显然也就比较小。 不言而喻,当待测试样原子序数较小时,a_k、b_k和δ_k显然可以较大,从而放宽了对临界条 件的要求并使得因波长变长信噪比下降的趋势得以补偿。

6. δ_{k} 随 印 角 变 化 的 估 算

最后(但最重要)应该特别指出,以上讨论均为0角一定的前提下进行的,在此前提下 所得结论能否适用于EXAFS测定(EXAFS测定是在改变θ的情况下完成的) 在视实验参 数是否随θ角的变化而变化及其变化程度。分析所得公式(6')和(7')可以看出、3,、S₁和 S₁'均与θ角无关,但在(12)式 $\delta_k = \frac{\Delta \theta_x + \Delta \theta_\lambda}{2}$ 中因 $\Delta \theta_x$ 是θ的函数(见24式)故 δ_k 亦为 θ的函数,因此保持 δ_k 不变,增大S₁的条件似乎不能成立。所幸,计算表明;在EXAFS 测量角范围(约为 $\theta \approx 2^{\circ}$)因 θ 角变化所导致的 $\Delta \theta_x$ 变化其最大值也仅仅显示在以度为单位 的小数点5位以后,可见在EXAFS测量的全部角范围可以认为 δ_k 与 θ 角无关,亦即由 θ 角 不变的假定下所导出的全部结论完全适用于EXAFS测定。

四、结 论

1. 当EXAFS的分辨本领(1000~2000范围内)一经确定,与此同时根据有关公式也 就确定了由作者所导出的入射狭缝S₁(要考虑到S₁'的数值),接收狭缝S₂和摆动曲线 宽度 的临界值 a_k 、 b_k 和 δ_k ,此时 a_k 、 b_k 和 δ_k 与EXAFS分辨本领和信噪比的关联是有条件的、 相互依存的。

2. 当 $S_1 = a_k$, $S_2 = b_k$ 时,分辨本领与摆动曲线宽度 δ 无关,而信噪比则取决于**嵌**粮 块大小对强度分布的影响和对消光效应的影响那个为主。

2. 当 $S_2 = b_k$, $\delta = \delta_k$ 时, 增大入射狭缝 S_1 至最 佳宽度 S_1k , 其分辨本领不变, 可显 一 揭高信噪比。 S_1 继续增大时, 无实际意义。

4. 当临界条件一经确定, S₂不可大于临界值bょ。而在聚焦分光 条件下则无此 限制。可以证明聚焦分光优于平晶分光(2)。

五、参考文献

- (1) F.W. Lytle, D.E. Sayers, E.A. Steen Phys. Rev. Bll. 4825(1975).
- (2) 刘建民、赵伯麟、陈训平,聚焦分光条件下EXAFS分辨率和信噪比与实验 诸参数 的关系(待发表)。
 - A Study of the Relationship Between the Resolution Signal to Noise Ratio and the Experimental Data of EXAFS

Liu Jianmin, Znao Bailin, Chen Xunping, Wu Ping

abstract

This paper describes in detail the relationship between the resolut tion, signal to noise ratio and the experimental data from EXAFS mea sure ment. It has been presented the opinion of critical condition for experimental data and the method of a precise measurement. The relationship between resolution, singnal to noise ratio and the critical experimental data have been discussed and the following conclutions ha ve been introduced at the critial condition:

1. The resolution is independent on the rocking curve width of the monochromator crystal when the width of entrance slit and exit slit both equal to the critial data but the signal to noise ratio depends on which is more important to the mosaic structure size that is charac terized by the rocking curve wicth of the mono-chromactor crystal; the intensity distribution or the extinction effect.

2. The entrance slit width increases to the optimum that the resolution keepsa constant and the signal to noise ratio increase obviously wh the width of exit slit and the rocking curve of monochromator crys tal equal to the critical data. But the signal to noise ratio does not in crease with the entrance slit width if the width is largerth an the op timum.

It has been shown in the paper that the conclution 1 is more suitable to that where the perfection of the monochromator crystal is not good enough; and the conclution 2 is fit to perfect crystal.